



電子顕微鏡の遠隔地立会システム

お客様のもとへ当社の技術をリアルタイムでお届けします。

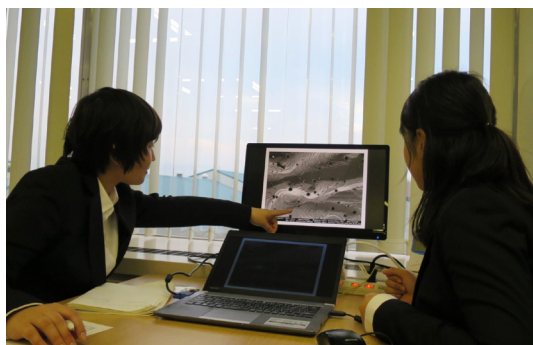
はじめに

走査電子顕微鏡(SEM)や透過電子顕微鏡(TEM)実験は、お立会いただくことでより有意義な結果になる場合が多々あります。このたび、当社のNo.1技術をお客様のオフィスにしながら体感していただける、遠隔立会システムを構築いたしました。お客様のニーズに的確に答えるとともに、時間的、経済的負担の軽減にも貢献します。

遠隔地・双方向の立会システム

- お客様サイトで電子顕微鏡画像、分析画面をリアルタイム表示できます。
- 双方向の音声通信ができます。
- お客様と、画像やデータをライブで共有しディスカッションすることで、適切な観察・分析視野の選定や、最適な観察・分析方法の方針決定が可能になります。

お客様オフィス

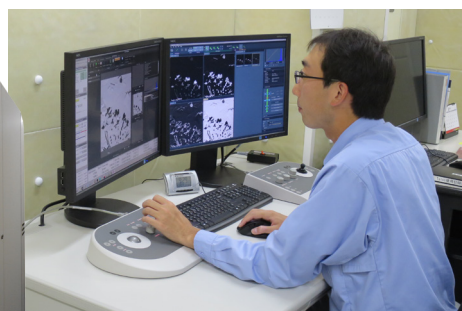
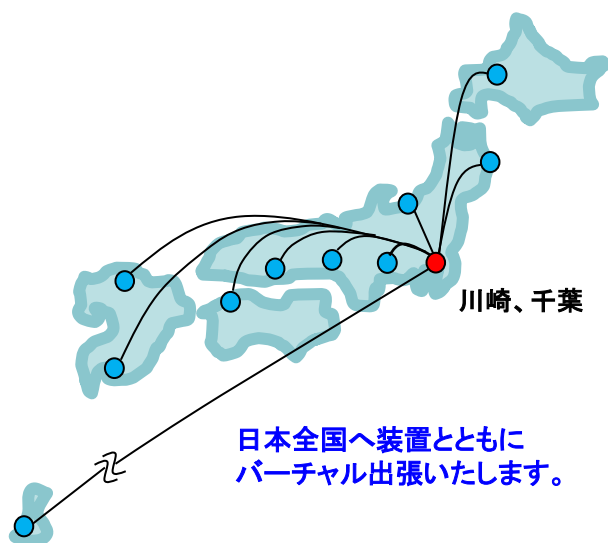
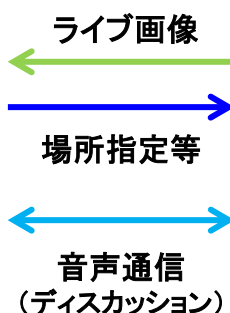


当社PC他(端末機器につきましてはご相談ください)

当社実験室(川崎、千葉)



極低加速 SEM



高感度EDX搭載FE-TEM



JFE テクノリサーチ 株式会社

<https://www.jfe-tec.co.jp>

0120-643-777

Copyright ©2018 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。